Issue Classification

Apı	plica	tion	/Contr	ol No

10550238

Examiner

Heyman, John

Applicant(s)/Patent Under Reexaminatio
--

KIM ET AL.

Art Unit

2871

ORIGINAL			INTERNATIONAL CLASSIFICATION												
CLASS SUBCLASS								С	LAIMED		_	1	ION-CL	AIMED	
349			106			G	0	2	F	1 / 1335 (2006.01	.01)				
	(CROSS REF	ERENCE((S)											
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)			OCK)		 						ļ	╁┼			
349	108	109	1			 						 	 		
			1			┢							 		
												<u> </u>			
•				<u>.</u>		<u> </u>	_								
			ļ			<u> </u>				-		1	<u> </u>		
		•	 			 						-	-	-	
						-	-				+		-	 	
	<u> </u>		 			 	 					 	ļ	\vdash	
			 	<u> </u>		\vdash						1	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· ·											ļ		
						_	_						ļ	-	
	ļ		-			<u> </u>						-	ļ	 	
	ļ														
	-		1 .			\vdash						-		1-1	
	· · · · · ·		†									+	<u> </u>		
				.,			-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1			
	, -						De all						7	E H	
															•
							ļ					_			
_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>								-	ļ	-	
			-	-	<u> </u>	 							┼	\vdash	
			 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	-		·	 		+	 	++	
						T			,				†	 	
				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>		
Heyman, John 11/01/2007 (Assistant Examiner) (Date)		AN PI	NOREW SCHECHTER PRIMARY EXAMINER 1/17/67						Total Claims Allowed: 니						
Muss chow 11260			Andrew	ew Schechter 11/01.2007				O.G. Print Claim(s)			O.G. Print Figur				
			(Primary	Examiner)	niner) (Date)					1 3				3	